
LARISSA VALMY, Université des Antilles et de la Guyane

Inférence statistique pour des processus ponctuels associés à un processus de Dirichlet

Nous nous intéressons aux occurrences d'un processus ponctuel spatio-temporel dont l'intensité est associée à un processus caché. Deux situations sont considérées : d'abord, nous disposons à chaque date d'observation de toutes les nouvelles positions des occurrences du processus depuis la précédente date d'observation sans information sur les dates précises d'occurrence; ensuite, nous disposons de comptages dans des unités spatiales obtenues par échantillonnage aléatoire systématique. Une approche inférentielle bayésienne utilisant des algorithmes MCMC est proposée dans les deux cas quand le processus observé est un processus de Cox dirigé partiellement par un processus de Dirichlet.